

ANEXO I. Características de los objetivos disponibles en el microscopio S Neox del Citius.

Objetivos de Campo Claro

Magnificación	NA(1)	WD(2) (mm)	FOV(3) (μm)	Spatial Sampling(4) (μm)	Resolución Óptica Verde (μm)	Resolución Óptica Azul (μm)	Resolución Óptica Rojo (μm)	Resolución Óptica Blanco (μm)	Máxima Pendiente (°)	Resolución Vertical (nm)
10x EPI	0.30	17.50	1754x1320	1.29	0.48	0.46	0.56	0.55	14	25
20x EPI	0.45	4.50	877x660	0.65	0.32	0.31	0.37	0.37	21	8
50x EPI	0.80	1	351x264	0.26	0.18	0.17	0.21	0.20	42	3
100x EPI	0.90	1	175x132	0.13	0.16	0.15	0.18	0.18	51	2
150x EPI	0.95	0.20	117x88	0.09	0.15	0.14	0.17	0.17	71	1

Objetivos Interferométricos

Magnificación	NA	WD (mm)	FOV (μm)	Spatial Sampling (μm)	Resolución Óptica Verde (μm)	Resolución Óptica Azul (μm)	Resolución Óptica Rojo (μm)	Resolución Óptica Blanco (μm)	Máxima Pendiente (°)
10x Di	0.30	7.40	1754x1320	1.29	0.48	0.46	0.56	0.55	14
20x Di	0.40	4.70	877x660	0.65	0.36	0.35	0.42	0.41	21
50x Di	0.55	3.40	351x264	0.26	0.26	0.25	0.31	0.30	25
100x Di	0.70	2.00	175x132	0.13	0.20	0.20	0.24	0.23	42
Resolución Vertical		PSI 0.1 nm(0.01 nm con PZT)							VSI 1 nm

(1) NA: Apertura Numérica.

(2) WD: Distancia de trabajo.

(3) FOV: Máximo campo de visión.

(4) Spatial Sampling: Tamaño de pixel